gurd for corbus

PAT-NO:

JP360218846A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60218846 A

TITLE:

DRY ETCHING APPARATUS

**PUBN-DATE:** 

November 1, 1985

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

YAMADĀ,\YUICHIRO TANNO, MASUO TOMITA, KAZUYUKI MIZUGUCHI, SHINICHI

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP59074068

APPL-DATE:

April 13, 1984

INT-CL (IPC): H01L021/302

US-CL-CURRENT: 257/E21.214

## ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a reaction product or the like from adhering on a lighttransmitting plate of a light-transmitting window and to enable the detection or radiation of light to be performed with good reproducibility, by interposing a cooling trap between the light-transmitting plate and the reaction chamber.

CONSTITUTION: When etching is carried out in a reaction chamber consisting of a vacuum container 11, any reaction product or the like produced thereby is adsorbed, before it reaches the inner face of a light-transmitting plate (glass) 13, by a cooling trap 14 in which cooling fluid flows and which is provided midway to a light-transmitting window 12, so that the inner face of the light-transmitting plate 13 is not contaminated by such a product. Accordingly, the light transmittance of the plate 13 is maintained constant, and therefore detection or radiation of light can be carried out stably. In the end point detection by spectro-chemical analysis, the end point spectral

strength is maintained constant thereby the end point detection is enabled to be performed with good reproducibility and high reliability.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

## 每日本国特許庁(JP)

49 特許出願公開

# 母公開特許公報(A)

昭60-218846

@Int\_CI.4 H 01 L 21/302 量別記号

**广内整理者号** B-8223-5F

❷公開 昭和60年(1985)11月1日

等査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

ドライエツチング装置

**244 1859-74068** 

●田 屬 昭59(1984)4月13日

60発 朔 者 山田 進 一 郎 6 期 海 ₽. 男 故 母 明 者 H 和 Ż 64条明者 水 口

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社內 門真市大字門真1006番地 松下電器虛凝株式会社內 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

門真市大字門真1006香地 松下電器產業株式会社内

人 鷹 出金 松下電器產業株式会社 80代 建 人 弁理士 中尾 敏男

門真市大字門真1006番城 外1名

## 1、発明の名称

ドライエッチング装置

### 2、特許請求の範囲・

真空容器と、この真空容器に連接した処理ガス 供給手段と、前記真空客器に連接した排気手段と、 善配真空等祭内で相対向配置した一対のプラスマ 発生用電極と、これら両電極関に高昂波電圧を印 加する高層故電源と、前配実空存器に設けられ論 配両電板間反応室からのプラズマ光を採り出すた . めの透光板をもつ透光度と、前配透光板の前配反 応塞側に配数されて反応生成物の過光板への付着 を防止する冷却トラップとを備えたドライエッチ ング装置。

## 3、発明の詳細を説明

産業上の利用分野

この発明はドライエッチング装置に関するもの できる。

従来例の構成とその問題点

従来のドライエッテング装置は、第1回にその .

具体的構成を示すように、真空容器1に図示され ない処理ガス供給手段がガス導入口2をもって追 着され、また図示されなり排気手段が排気口8を もって連絡され、上記真空存得1の内部には、上 部電艦4と、試料5の支持会を兼ねる下部電艦6 とが設けられて両電征間を反応室でとし、両電極 4 , 6 のいずれか一方には高周被電源 B が接続さ れてかり、試料ををエッチング中のプラスマに対 し、透光窓9に散けられた透光板(ガラス)10 を通して、プラメマ光を検出して分光分析による エッテングプロセスのモニタリング、終点検出を 行い、あるいは、透光板(ガラス)10を通して プラズマや試料のに光を風射することにより、プ ラズマ状態や試料 5各面の状態を変化させてエッ ナング特性の向上を困っていた。

しかしながら上配のような構成では、飲料さを エッチングする際に生ずる反応生成物等が透光板。 (ガラス)10の表面に付着堆積するため、透光 複(ガラス)10の光の透過率が不安定かつ減少 し、たとえば先を検出して分光分析の上エッテン

グ終点検出を行なり歌や、光を照射してエッチング機構を向上させる際に良好な再現性が得られず、 エッチング装置として信頼性に欠けるという欠点 ' を有していた。

#### 発明の目的

との発明の目的は、エッテング中に生ずる反応 生成物等が透光度の透光板に付着することを防ぎ、 透光板を通して行なり光の検出や、光の限制を再 現性良く行なえるドライエッテング装置を提供す ることである。

#### 発男の構成

との発明のドライエッチング装置は、冷却トラップを、透光板と反応室の間に挿入したことを特象とし、透光板表面に反応生成物が付着して光の透過率が減少かつ不安定とをることを防ぐ効果を有するものである。

#### 実施例の説明

この発明の第1の実施例を第2図ないし第4図 を用いて説明する。第2図はドライエッチング装 値の要部新視図である。11は実空容器であり、

同一材質は料のエッチングを速接的に行なうと透光板(ガラス)13内面への反応生成物の付着量の増加に伴ってエッチング鉄点のスペクトル強度は減少するが(曲線 A 参照)、本実施例によれば、第4回に示すように、反応生成物が冷却トラップ14に吸着される結果透光板(ガラス)13内面への付着物はほとんどさく、このため、美点のスペクトル強度は連続的なエッチングに対して一定に保たれ(曲線 B 参照)、再現住良くかつ信頼性の高い表点検出が可能である。ただし、第3・4回にかいては、A4 エッテング条件として、処理ガスの04、ガス進量208COM、真空度0.107000で、高温波電線パワー1207では、51、75は各試料ごとのエッチング時間を示す。

第5回は本発明の第2の実施例におけるドライエッチング装置の要部外視回である。11は真空 等器、12は透光度、13は透光板(ガラス)、 14はたとえばステンレスからなる冷却トラップ。 であり、第2回と異なる点は、冷却トラップ14

との真空容器11には外部に図示されない処理ガ ス供給手段と排気手段が連結され、また真空容器 11の内部には、図示されない上部電話と下部電 極が設けられ、両電極のいずれか一方に図示され たい高角放電点を接続するととにより、異常極間 は下部電極に設置された試料に対するエッチング 反応電となる。12仕真空容器11の一部に殴け られた透光度、13は透光板(ガラス)、14は 図示されない冷却手段化より冷却された冷却液が 内部を洗れるたとえばステンレスパイプからなる 冷却トラップである。反応盒でエッテングが行な われている際、生じた反応生成物等は、透光板 (ガラス)18の内面に達する前に透光度12の . 油中に設けられた冷却トラップ14に吸着され、 透光板(ガラス)18の内面は朽されることがな い。したがって、本実施例によれば、透光板(ガ ヲス)13の光の透過率は一定に保たれるため、 光の検出や照射を安定に再現性良く行なうことが、 可能である。たとえば分光分析による終点検出に かいて、従来の構成では、第3回に示すように、

の形状である。本実施例の奇却トラップ14は中心部に光の通る中空穴を設け、外壁内部に冷却水の施路を設けた形状を割してかり、反応生成物は透光級(ガラス)13の内面に達する前に、冷却トラップ14の中空穴表面に吸着される。

第6回は本発明の第3の実施例におけるドライエッチング装置の要部所面図である。11は真空容器、12は透光板(ガラス)、14はたとえばステンレスからなる冷却トラップであり、第6回と異なる点は冷起トラップ14の外形を例えばフィン状にして吸着面積を増加させ、反応生成物の表着をより効果的にしたものである。

なか、上記第1 , 第2及び第3の実施例にかいては、冷却トラップ14を内部に冷却被を確せるようにしたものとしたが、冷起液の代わりに冷却ガスを能しても良い。

また冷却トラップ14には例えば液体窒素を充 奨する方法をとっても良い。

#### 発明の効果

との発明のドライエッチング装置によれば、透

光板を通して行なり光検出や光照射等の再現性を 高めることにより、信頼性の高いエッチングを行 なえる効果が得られる。

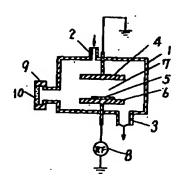
#### 4、図面の簡単な説明

第1図は従来のドライエッテング装置の概略所 面図、第2図はこの発明の第1の突施例の要部針 視図、第3図は従来例にかけるエッチング表点検 出用スペクトル強度図、第4回は第1の突施例に かけるエッチング表点検出用スペクトル強度図で ある。第6回は第2の実施例の要部針視図、第6 図は第3の実施例の要部所面図である。

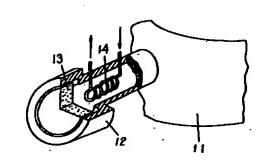
4 , 6 ······電極、 7 ······ 反応室、 8 ·······高周波 電源、 1 1 ······- 真空容器、 1 2 ······ 透光度、 1 3 ······ 透光板(ガラス)、 1 4 ······ 冷却トラップ。

> マスのであ 現 鉄 周 中 七里未 ネエペコ

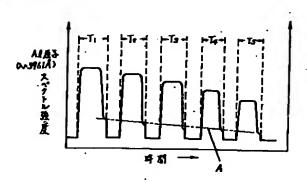
第 1 図



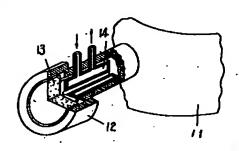
第 2 - 50



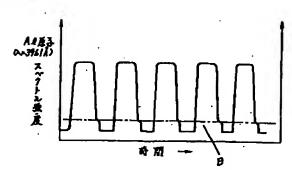
赛 3 🖾



#K 5 150



第 4 図



NS 6 129

